#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (II)特許出願公開番号 特開平9-36423

(43)公開日 平成9年(1997)2月7日

С

(51)Int.Cl.4	
LIAIT	22/00

識別記号 庁内整球番号

FI H01L 33/00 技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 4 頁)

(21)出願番号
----------

特膜平7-209183

(22)出窗日

平成7年(1995)7月24日

(71)出願人 000241463

豊田合成株式会社

愛知県西春日井都春日町大字落合字長畑1 番魚

(72)発明者 小池 正好

爱知県西春日井郡春日町大字茲合字号畑1

番地 豊田合成株式会社内

FAS SINGAMARALIN

(72)発明者 浅見 慎也

爱知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1 番地 豊田合成株式会社内

番地 复田石成株式云在内

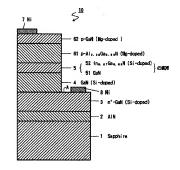
(74)代理人 弁理士 藤谷 修

### (54) 【発明の名称】 3族窒化物半導体発光素子

### (57)【要約】

【目的】3族窒化物化合物半導体を用いた紫外線発光索 子の発光効率の向上。

【構成】発光層5は、膜厚約100 AのIn。。76a。。7N から成る20層の井戸層52とこの井戸層よりも禁制帯幅の広いGaN から成る21層のパリア層51とを交互に多数報層させた多電量子井戸で構成され、各井戸層52にシリコンを濃度5×10<sup>11</sup>/cm³に添加した。シリコンによるドナー準位が各井戸層52に形成されるため、発光に寄与する電子とホールとの再結合確率が増大するために、紫外線の発光強度が向上する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】発光層に3族窒化物半導体を用いた発光素 子において、

前記発光層は、Alx1Gay1In1-x1-Y1N から成る井戸層と この井戸層よりも禁制帯幅の広いAlx2Gay2In1-x2-y2N から成るバリア層とを交互に積層させた量子井戸で構成 され、前記各井戸層にドナー不純物又はアクセプタ不純 物を添加したことを特徴とする3族窒化物半導体発光素 子。

【請求項2】前記パリア層はGaN から成ることを特徴と 10 する諸求項1に記載の3族窒化物半導体発光素子。

【請求項3】前記ドナー不純物はシリコン(Si)、テルル (Te)、イオウ(S) 、又は、セレン(Se)であり、前記アク セプタ不純物は、マグネシウム(Mg)、又は、亜鉛(Zn)で あることを特徴とする3族窒化物半導体発光素子。

【請求項4】前記井戸層に添加する不純物の濃度は1× 1017~5×1018/cm3であることを特徴とする請求項 1に記載の3族窒化物半導体発光素子。

【請求項5】前記井戸層と前記パリア層は格子定数が一 致していることを特徴とする請求項1に記載の3族窒化 20 物半導体発光素子。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は紫外線発光の効率を 向トさせた3族窒化物半導体を用いた発光素子に関す

#### [0002]

【従来技術】従来、3族窒化物半導体を用いた紫外線発 光素子は、発光層にInGaN 又はAlGaN が用いられてい た。発光層にInGaN を用いた場合には、Inの組成比が 5.5%以下の時、パンド間発光で波長380nm以下 の紫外線が得られている。

#### [00003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この構造の発 光索子は、また、発光効率が低いという問題がある。即 ち、発光層にInGaN を用いた場合には、低温成長のため に発光層の結晶性が悪く、発光効率が低い。又、パンド 間のキャリア再結合による発光のために、発光効率が悪 いという問題がある。

れたものであり、その目的は、3族窒化物化合物半導体 を用いた紫外線発光素子の発光効率を向上させることで ある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、発光層に3族窒化物半導体を用いた発光素子におい て、発光層は、AlxiGayiIn:-x:-yiN から成る井戸層と この井戸層よりも禁制帯幅の広いAlx2Gay2In1-x2-y2N から成るパリア層とを交互に積層させた量子井戸で構成 され、各井戸層にドナー不純物又はアクセプタ不純物を 50 5 ×10<sup>18</sup>/cm<sup>2</sup>の濃度に添加されている。

添加したことを特徴とする。量子井戸構造の繰り返し回 数は1回でも多数回でも良い。

【0006】又、請求項2の発明は、パリア層をGaN で 構成したことを特徴とし、請求項3の発明は、井戸層に 添加するドナー不純物をシリコンとし、請求項4の発明 は、不純物の濃度を1×10<sup>17</sup>~5×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup>とした ことを特徴とし、請求項5の発明は井戸層とバリア層と で格子定数を一致させたことである。尚、不純物濃度が 1×1017/cm3より小さいと発光効率が低下するため望 ましくなく、5×1018/cm3よりも大きいと結晶性が低 下するため望ましくない。又、添加する不純物としては 浅い準位を形成するものが良い。ドナー不純物原子とし ては、イオウ(S) 、テルル(Te)、セレン(Se)等が使用で き、アクセプタ不純物原子としては、マグネシウム(M

#### [0007]

g)、亜鉛(Zn)が使用可能である。

【発明の作用及び効果】発光層をAlGaInN の多重量子井 戸構造とし、井戸層にドナー不純物又はアクセプタ不純 物を添加した。このため、ドナー準位、又は、アクセプ 夕準位が形成されるため、発光に寄与する電子とホール の再結合確率が増大するため、再結合による発光効率が 向上する。又、インジウムの組成比と不純物濃度は、希 望する発光ピーク波長と発光強度との関係で決定され る。

### [8000]

# 【実施例】

第1 実施例 図1において、発光ダイオード10は、サファイア基板 1を有しており、そのサファイア基板 1 上に500 ÅのAl 30 N のパッファ層 2 が形成されている。そのパッファ層 2 の上には、順に、膜厚約5.0 μm、濃度 5×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup>の シリコンドープGaN から成る高キャリア濃度n+層3、 膜原約0.5 μm、濃度 5×1017/cm3のシリコンドープの GaN から成る n層 4、全膜厚約0.41μmの発光層 5、膜 厚約0.5μm、ホール濃度5 ×10<sup>17</sup>/cm³、濃度 5×10<sup>20</sup>/ cm<sup>3</sup>にマグネシウムがドープされたAl。。。Gao. o2N から 成るp層61、膜厚約1 μm、ホール濃度 7×1018/c m<sup>3</sup>、マグネシウム濃度 5×10<sup>21</sup>/cm<sup>3</sup>のマグネシウムドー プのGaN から成るコンタクト層62が形成されている。 【0004】本発明は上記の課題を解決するために成さ 40 そして、コンタクト層62上にコンタクト層62に接合 するNiから成る電極7が形成されている。さらに、高キ

> 【0009】発光層5の詳細な構成は、図2に示すよう に、膜厚約100 ÅのGaN から成る21層のパリア層51 と膜厚約100 ÅのIno.orGao.orN から成る20層の井戸 層52とが交互に積層された多重量子井戸構造で、全膜 厚約0.41µmである。又、井戸層52には、シリコンが

ャリア濃度 n \* 層 3 の表面の一部は露出しており、その

露出部上にその層 3 に接合するNiから成る電極 8 が形成

[0010] 次に、この構造の発光ダイオード10の製造方法について説明する。上記発光ダイオード10は、有機金属化合物気相成長法(以下「MOVPE」と記す)による気相成長により製造された。用いられたガスは、MI。とキャリアガスR。又はN、とトリメチルガリウム( $Ga(CH_s)_s$ )(以下「TMG」と記す)とトリメチルアルミニウム( $AI(CR_s)_s$ )(以下「TMI」と記す)とトリメチルアルジウム( $AI(CR_s)_s$ )(以下「TMI」と記す)とシラン( $SiH_s$ )とクロペンタジェニルマグネシウム( $Mg(C_sH_s)_s$ )(以下「TMI」と記す)とシラン( $SiH_s$ )とシウロペンタジェニルマグネシウム( $Mg(C_sH_s)_s$ )(以下「TMI」と記す)である。

[0011]まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄した α面を主面とする厚さ100~400 川瓜の単結局のサファ イア基板 1をMOVE 装置の反応室に載置されたサセプタ に装着する。次に、常圧でH.を流速2 liter/分で反応室 に流しながら温度1100℃でサファイア基板 1を気相エッ チングした。

【0012】次に、温度を 400°Cまで低下させて、H<sub>2</sub>を 20 liter/分、MH<sub>3</sub>を 10 liter/分、TMA を 1.8×10<sup>-16</sup> モル/分で供給してAIN のパッファ層 2 が約 500Aの厚さに形成された。次に、サファイア基板 1 の温度を1150 20 °Cに保持し、H<sub>3</sub>を20 liter/分、MH<sub>3</sub>を10 liter/分、TMG を 1.7×10<sup>-4</sup>ル/分、H<sub>3</sub>ガスにより0.86ppm に希釈されたシランを200ml/分で 7 0分供給して、誤厚約 5 μ m、濃度 5×10<sup>-18</sup>/cm<sup>2</sup>のシリコンドープのGaN から成る高キャリア過度 n \* 層 3 を形成した。

[0013] 次に、サファイア基族 1の温度を1100℃に 保持し、N<sub>2</sub>又はH<sub>2</sub>を10 liter/分、HH, を 10liter/ 分、TMG を1.12×10<sup>-1</sup>モル/分、及び、H<sub>2</sub>ガスにより0、 80pmに希釈されたシランを10×10<sup>-1</sup>mol/分で、30分供 給して、膜厚約0.5 μm、選度5×10<sup>-1</sup>/cm<sup>2</sup>のシリコン ドープのGaN から成るn層 4を形成した。

【0014】その後、サファイア基板1の温度を850℃に保持し、H,を20liter/分、MH。を10liter/分、TMGを1.75~10mmのでは、MH。を10liter/分、TMGを1.75~10mmのでは、MH。を10liter/分、TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMGを2.1×10~4~10分。TMG2.1×10分。TMG2.1×10分。

[0 0 1 5] 続いて、温度を1100°Cに保持し、N<sub>2</sub>仪柱。 を20 liter/分、NH。を 10liter/分、TMG を1.12×10 "モル/分、TMA を0.47×10"モル/分、及び、CP。Mg を2×10"モル/分で30分間導入し、誤厚約0.5 μmの マグネシウム(Mg)ドープのAl。。sgR。sgN から成るり層 61を形成した。p 層 61のマグネシウムの遺腔は 5× 10°°/cm³である。この状態では、p層61は、また、抵 抗率10°Ωcm以上の絶縁体である。

【0016】続いて、温度を1100℃に保持し、N₂又はH₂ を20 liter/分、NH₂ を 101iter/分、TMG を1.12×10 "キルノ分、及び、CP₂Mg を 4×10" キルノ分の割合で 分間導入し、膜厚約1 μmのマグネシウム(Mg)トープ のGaN から成るコンタクト層 6 2を形成した。コンタク ト層 6 2のマグネシウムの過度は 5×10²1/cm²である。 この状態では、コンタクト層 6 2 は、まだ、抵抗率10° 10 Ωcm以上の絶縁体である。

【0018】次に、図3に示すように、コンタクト層 6 2の上に、スパッタリングにより8i0。層 9 を2000Aの厚 さに形成し、その8i0。層 9 上にフォトレジスト10を塗 布した。そして、フォトリソグラフにより、図3に示す ように、コンタクト層 6 2 上において、高キャリア通度 n・層3に対する電極形成部位 A・のフォトレジスト1 0を除去した。次に、図4に示すように、フォトレジスト ト10によって覆われていない8i0。層 9 をフッ化水楽機 系エッチング液で除去した。

【0019】次に、フォトレジスト10及びSi0。層9に よって覆われていない部位のコンタクト階62、p層6 1、発光層5、n層4を、真空度0.04Torr、高周波電力 30 0.44W/cm²、BCl。ガスを10 nl/分の割合で供給しドライ エッチングした後、Arでドライエッチングした。この工 程で、図5に示すように、高キャリア濃度n・層3に対 する電極販出しのための孔Aが形成された。

【0020】次に、試料の上金面に、一様に別iを蒸着 し、フォトレジストの途布、フォトリソグラフィ工程、 エッチング工程を経て、図 1に示すように、高キャリア 適度 n・層 3 及びコンタクト層 6 2に対する電極 8,7 を形成した。その後、上記の如く処理されたウエハを チップに切断して、発光ダイオードチップを得た。

[0021] このようにして得られた発光素子は、駆動 電流20m4で、発光ピーク波長380m、発光強度2mW であった。この発光効率は3%であり、従来の構成のも のに比べて10倍に向上した。

【0022】このように、未発明は活性化エネルギーの 小さいドナー不純物原子、又は、アクセプタ不純物原子 を発光層の井戸層に添加しているので、発光中心の数が 増え、発光効率が向上する。上記の実施例では、発光層 5のパリア層51のパンドギャップが両側に存在する p 層61とn層4のパンドギャップよりも小さくなるよう 50 なダブルヘテロ接合に形成されている。上記実施例では (4)

ダブルヘテロ接合構造を用いたが、シングルヘテロ接合 構造であっても良い。さらに、p層を形成するのに熱処 理を用いたが、電子線照射によってp型化しても良い。

【0023】上記実施例では、発光層5の井戸層52に Ino. o7Gao. o3N を用いたが、Alo. o3Gao. soIno. osN 等の 4元系の3族窒化物半導体を用いてもよい。又、パリア 層51にGaN を用いたが、井戸層52の禁制帯幅よりも 大きな禁制帯幅を有するAlx2Gay2In1-x2-y2N 半導体を 用いても良い。又、発光層5の多重量子井戸の繰り返し 層数は 1 ~ 2 0 程度を用いることができる。さらに、バ 10 1 …サファイア基板 リア層51と井戸層52は略格子定数を一致させるよう に組成比を選択するのが良い。

【0024】尚、上記実施例では、発光ダイオードにつ いて示したが、本発明をレーザダイオードにも応用する ことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の具体的な実施例に係る発光ダイオード の機成を示した構成図。

【図2】同実施例の発光ダイオードの製造工程を示した

断面図。

【図3】 同実施例の発光ダイオードの製造工程を示した 断面図。

【図4】同実施例の発光ダイオードの製造工程を示した 断面図。

【図5】 同実施例の発光ダイオードの製造工程を示した 新面図。

### 【符号の説明】

10…発光ダイオード

2…パッファ屑

3…高キャリア濃度 n+ 層

4…n層 5 …発光層

51…パリア層 52…井戸層

61…p層

62…コンタクト層

7、8…電極

